

Семинар-практикум, 6 параллельных сессий, 18 тем
Составьте свое расписание!

ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ



Москва, 2 апреля 2019

Уважаемые коллеги!

Компания **Keysight Technologies** (ранее Группа электронных измерений **Agilent**) приглашает своих заказчиков **2 апреля 2019** на обучающий семинар для повышения компетенций инженеров и R&D-специалистов в высокотехнологичных отраслях, в рамках которого высококвалифицированные специалисты компании **Keysight Technologies** прочитают **лекции по основам измерений**.

Для удобства участников семинар будет состоять из **6 параллельных сессий**, в рамках которых будут представлены **18 тем**. Каждый участник сам выбирает темы и в течение дня сможет посетить только интересующие его модули программы.

В рамках семинара мы хотим познакомить участников с основными областями применения наших приборов, рассмотреть основные виды выполняемых измерений и их характеристики. Семинар будет интересен как молодым специалистам, так и всем, кто хочет освежить и углубить свои знания.

Предлагаем участникам прослушать следующие темы:

Оборудование	Темы
Анализ и формирование сигналов	1. Основы анализа сигналов и спектра 2. Основы формирования сигналов 3. Основы тестирования на ЭМС 4. Основы измерений фазовых и амплитудных шумов 5. Основы геолокации и принципы построения систем спектрального мониторинга
Анализ компонентов, цепей и параметров материалов	6. Основы анализа цепей в ВЧ- и СВЧ-диапазоне 7. Проведение измерений и поиск неисправностей ВЧ-/СВЧ-оборудования в полевых условиях 8. Методики измерения параметров материалов в ВЧ-/СВЧ-диапазоне 9. Измерения параметров усилителей на анализаторах цепей
Высокоскоростные устройства и тестирование в оптическом диапазоне	10. Основы работы с низкоскоростными приложениями в осциллографии 11. Основы работы с высокоскоростными приложениями в осциллографии 12. Основы тестирования оптических приемопередатчиков 13. Основы рефлектометрических измерений для анализа целостности сигналов в кабелях и межсоединениях
Тестирование полупроводниковых устройств	14. Основы параметрических измерений
Электрическая мощность и ток	15. Основы работы с программируемыми источниками питания. Основы анализа электрической мощности и тока
Метрология	16. Основы калибровки, расчет неопределенности. Практические основы построения метрологической лаборатории
Автоматизация тестирования	17. Основы создания систем автоматизированного тестирования РЭА
Интернет Вещей	18. Основы технологии Интернета вещей

Мы постарались составить расписание так, чтобы была возможность в течение дня посетить несколько фундаментальных тем по основам измерений и несколько более специализированных тем.

Количество участников на каждый модуль ограничено. Прежде чем отправить заявку на регистрацию, ознакомьтесь с расписанием:

10.10 - 11.10	11.20 - 12.20	12.35 - 13.35	13.45 - 14.45	15.30 - 16.30	16.40 - 17.40
1. Основы анализа сигналов и спектра	2. Основы формирования сигналов	1. Основы анализа сигналов и спектра	2. Основы формирования сигналов	1. Основы анализа сигналов и спектра	2. Основы формирования сигналов

3. Основы тестирования на ЭМС	4. Основы измерений фазовых и амплитудных шумов	3. Основы тестирования на ЭМС	5. Основы геолокации и принципы построения систем спектрального мониторинга	16. Основы калибровки, расчет неопределенности. Практические основы построения метрологической лаборатории	4. Основы измерений фазовых и амплитудных шумов
6. Основы анализа цепей в ВЧ- и СВЧ-диапазоне	7. Проведение измерений и поиск неисправностей ВЧ/СВЧ оборудования в полевых условиях	9. Измерения параметров усилителей на анализаторах цепей	6. Основы анализа цепей в ВЧ- и СВЧ-диапазоне	8. Методики измерения параметров материалов в ВЧ/СВЧ диапазоне	9. Измерения параметров усилителей на анализаторах цепей
10. Основы работы с низкоскоростным и приложениями в осциллографии	11. Основы работы с высокоскоростным и приложениями в осциллографии	10. Основы работы с низкоскоростным и приложениями в осциллографии	11. Основы работы с высокоскоростным и приложениями в осциллографии	10. Основы работы с низкоскоростными приложениями в осциллографии	11. Основы работы с высокоскоростными приложениями в осциллографии
12. Основы тестирования оптических приемопередатчиков	14. Основы параметрических измерений	13. Основы рефлектометрических измерений для анализа целостности сигналов в кабелях и межсоединениях	15. Основы работы с программируемым и источниками питания. Основы анализа электрической мощности и тока	14. Основы параметрических измерений	15. Основы работы с программируемыми источниками питания. Основы анализа электрической мощности и тока
17. Основы создания систем автоматизированного тестирования РЭА	17. Основы создания систем автоматизированного тестирования РЭА	16. Основы калибровки, расчет неопределенности. Практические основы построения метрологической лаборатории	18. Основы технологии Интернета вещей	17. Основы создания систем автоматизированного тестирования РЭА	18. Основы технологии Интернета вещей

Ждем Вас на семинаре, посвященном контрольно-измерительному оборудованию **2 апреля 2019** в течение дня с 10:00 до 18:00.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация. В заявке, пожалуйста, укажите ФИО, место работы, контактные данные, и темы, которые вы хотите прослушать (не более 6), предварительно обязательно ознакомьтесь с расписанием, так как некоторые темы могут пересекаться по времени. В ответ на вашу заявку мы направим вам подтверждение регистрации, схему проезда и ваше индивидуальное расписание.

Регистрационную форму, пожалуйста, по эл. почте seminar.ru@keysight.com

Регистрационная форма в формате excel	https://yadi.sk/d/1VupFgHliTTwcw
---------------------------------------	---

Подробную информацию, список тем и расписание смотрите также на сайте: www.keysight.ru/find/russia_events

Семинар-практикум заявка на участие

Основы измерений

2 апреля 2019

Заполните заявку в [excel \(загрузите по ссылке\)](#) или форму ниже

Заявку отправьте по эл. почте seminar.ru@keysight.com

ФИО			
Организация			
Должность		Отдел	
Телефон	()	Факс	()
e-mail			
Город		Почтовый индекс	
Адрес			

Укажите, пожалуйста, темы, которые вам интересны (не более 6).

Время	Тема
10.10 - 11.10	
11.20 - 12.20	
12.35 - 13.35	
13.45 - 14.45	
15.30 - 16.30	
16.40 - 17.40	